

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 弓削哲史 副委員長 安里 彰

幹事 田村信幸・平栗滋人 幹事補佐 井上真二・岡村寛之

日時 11月15日(木) 14:00~16:20

会場 中央電気倶楽部(大阪市北区堂島浜2-1-25. 大阪駅より徒歩約12分. JR北新地駅より徒歩6分. 地下鉄四ツ橋線; 西梅田駅より徒歩6分. 京阪中之島線; 渡辺橋駅より徒歩5分. <http://www.chuodenki-club.or.jp> TEL [06] 6345-6351 (会場) 柳井健太郎(オムロン))

議題 半導体と電子デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. 湿度加速試験一考察(その2) 伊藤貞則(イトケン事務所)
2. ステップストレス試験結果に基づく加速モデルの選択(2) 松岡敏成(三菱電機)
3. 深層学習を用いた階層ベイズモデルに基づく信頼性解析 貝瀬 徹(兵庫県立大)
4. 故障件数データのベイズ統計解析に関する考察 貝瀬 徹(兵庫県立大)
5. 共通原因故障解析に関するいくつかの話題 弓削哲史(防衛大)

◆日本信頼性学会; 関西支部, IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催

☆R 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

12月15日(土) 沖縄県〔締切済〕テーマ: 信頼性国際規格, 保全性, 信頼性一般

2019年2月15日(金) パナソニック企業年金基金松心会館〔12月10日(月)〕テーマ: 機構デバイスの信頼性, 信頼性一般 (共催: 信頼性研究会, 継電器・コンタクトテクノロジー研究会, IEEE EPS JAPAN)

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<https://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

岡村寛之(広島大)

E-mail: okamu@hiroshima-u.ac.jp